希望審査分野表

区分	大分類（分科会）			中分類（研究手法分野）	小分類（サイエンス分野）	主たる対象BL
	名称	名称（英）	略称			
散乱回折	小角・広角散乱	Diffraction_SAXS/WAXS	**DS1**	小角散乱、広角散乱	物質材料系、生物系、その他	03XU, 19B2, 40B2, 40XU
	X線回折（単結晶）	Diffraction_Single Crystal	**DS2**	結晶構造解析、電子密度解析、in-situ operando粉末回折、格子歪み	有機系結晶、無機系結晶、金属錯体、MOF、その他	02B1, 05XU, 40XU
	X線回折（粉末）	Diffraction_Powder	**DS3**	定性分析、定量分析、リートベルト解析、電子密度解析、格子歪み、in-situ operando粉末回折、結晶子サイズ、結晶角解析、配向度解析	有機系結晶、無機系結晶、金属錯体、MOF、その他	02B2, 12B2, 13XU, 19B2, 44B2
	X線回折（汎用・構造評価）	Diffraction_General	**DS4**	PDF、逆格子マッピング、反射率、CTR、ナノ回折、回折トポグラフィ、応力測定、薄膜X線回折、in-situ operando X線回折	非晶質材料、表面・界面、薄膜、ナノ構造、その他	04B2, 08W, 13XU, 16XU, 19B2, 28B2, 29XU
	X線回折（高圧）	Diffraction_High Pressure	**DS5**	高圧構造解析、高圧ラジオグラフィ	高圧物性、材料合成、地球・惑星科学、超高圧発生技術、その他	04B1, 10XU, 15XU
分光・分光イメージング	汎用XAFS汎用MCD	Spectroscopy_XAFS	**SP1**	汎用XAFS、 XMCD、 複合XAFS、in-situ XAFS、時分割XAFS (いずれも、HX、 SXを含む)	電池・触媒材料、磁性材料、構造材料、地球惑星・環境系物質、その他	01B1, 12B2, 14B2, 25SU, 27SU, 36XU, 39XU
	先端X線分光	Spectroscopy_Advanced	**SP2**	分光イメージング、磁性イメージング、X線発光分光、X線ラマン散乱、蛍光X線分析、微量分析、顕微XAFS	電池・触媒材料、電気・光・磁性材料およびデバイス、物性物理・物質科学、生物系・医学系材料、地球惑星・環境系物質、その他	12XU, 17SU, 25SU, 27SU, 37XU, 39XU
	光電子分光	Spectroscopy_PES	**SP3**	HAXPES、 PES (SX)、 PEEM	物質材料、磁性材料、表面・界面、電池・触媒材料、その他	09XU, 12XU, 17SU, 25SU, 46XU
	赤外分光	Spectroscopy_IR	**SP4**	赤外分光、赤外イメージング	化学系材料、赤外物性、その他	43IR
イメージング	イメージング	Imaging	**IMG**	マイクロ/ナノCT、 高速度撮影、 トポグラフィ、 光学素子開発評価	物質系材料、生物・医学系、地球・惑星科学、イメージング技術開発、その他	20B2, 20XU, 28B2, 29XU, 47XU
非弾性散乱	非弾性散乱	Inelastic Scattering	**IXS**	核共鳴散乱、高分解能X線非弾性散乱、コンプトン散乱	核共鳴散乱（弾性含む）、高分解能X線非弾性散乱、コンプトン散乱、その他	08W, 19LXU, 35XU, 43LXU
構造生物学	構造生物学	Structural Biology	**SB**	生体高分子結晶回折、生物試料溶液散乱	生体高分子結晶回折、生物試料溶液散乱、生体高分子結晶回折 + CryoTEM、生物試料溶液散乱 + CryoTEM、生体高分子結晶回折 + 生物試料溶液散乱 + CryoTEM	26B1, 32XU, 38B1, 41XU, 45XU
産業利用	産業利用	Industrial Application	**IND**	散乱回折、分光・分光イメージング、イメージング、非弾性散乱、その他	小角・広角散乱、X線回折（単結晶）、X線回折（粉末）、X線回折（汎用・構造評価）、X線回折（高圧）、汎用 XAFS・汎用MCD、先端X線分光、光電子分光、赤外分光、イメージング、非弾性散乱、その他	全BL
人文・社会科学	人文・社会科学	Humanities and Social Science	**HSS**	同上	同上	全BL
その他	その他（持込装置利用）	Others	**OTH**	主に持ち込み装置利用	蛍光X線ホログラフィー、その他持ち込み装置利用	持ち込み対応BL (47XU, 29XU, 32B2)